

半導体デバイス信頼性 故障メカニズムセミナー

改訂JEITA技術レポート(EDR-4707A)をJEITAエキスパートが解説します
 「※JEITA EDR-4707A: LSIの故障メカニズム及び試験方法に関する調査報告」

主催・企画：一般社団法人 電子情報技術産業協会 半導体信頼性技術委員会

半導体デバイスの微細化開発が継続されています。世代の進歩に伴い材料、デバイス構造も変化しており、その故障メカニズムについても年々新たな考察が出てきています。故障メカニズムは半導体の信頼性保証に必須の知見です。しかし近年半導体産業はFoundryを活用した分業化が広く進んでおり、先端技術のデバイスの信頼性、特に最新故障メカニズムに基づいた考察を直接の評価で確認することはごく限られた範囲でしかできない状況になってきています。

JEITAでは半導体信頼性の考え方、特に摩耗故障の故障メカニズムとその信頼性モデルの内容について、最新の学会動向も含め改訂版技術レポートEDR4707Aにまとめ、2018年3月に発行致しました。今回、このEDR4707Aの内容を中心に解説します。

基本的な内容から、メカニズムの詳細を理解されたい方、最新のモデルの動向について知りたい方に向けた内容となっております。基本から理解したい方に加え、過去にJEITAセミナーに参加された方にも、理解を深め拡げて頂ける内容としております。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

日時

2018年 7月31日(火) 9:30~16:45

会場

連合会館 401会議室

Program

司会:

松山英也 (株)ソシオネクスト)

若井伸之 (東芝デバイス&ストレージ(株))

9:30	開催のご挨拶 半導体信頼性技術委員会
午前	概要説明 FEOL基礎および個別故障メカニズム(HCI/BTI/TDDB)
	酸化膜界面の基礎からHigh-K/MetalGate、FinFETの説明、個別故障メカニズムを基本から最近の学会動向を含め説明いたします。
昼食	
午後前半	大日方浩二 (ソニー(株))、田中 宏幸 (ラピスセミコンダクタ(株)) 志賀 克哉・茂野 洋一(ルネサスエレクトロニクス(株))、細野 剛(ローム(株))
休憩	BEOL基礎および個別故障メカニズム(EM/SM/BEOL-TDDB/MOL)
午後後半	配線金属の輸送モデルを個別のメカニズムごとに説明し、個別故障メカニズムを基本から最近の学会動向を含め詳細に説明いたします。
	高島 智 (新日本無線(株))、若井 伸之(東芝デバイス&ストレージ(株)) 松山 英也 (株)ソシオネクスト)
	閉会のご挨拶・アンケート

各セッションの終了時に質疑応答時間を設けます。

プログラムの内容につきましては、変更となる場合もございますので予めご承知おきください。

半導体デバイス信頼性 故障メカニズムセミナー

改訂JEITA技術レポート(EDR-4707A)をJEITAエキスパートが解説します
 「※JEITA EDR-4707A: LSIの故障メカニズム及び試験方法に関する調査報告」

参加要領

■日時 2018年7月31日(火) 9:30~16:45 (開場 9:00)

■場所
 連合会館 401会議室
 (〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3-2-11)
<http://rengokaikan.jp/access/index.html>

■申込期限 2018年7月24日(火) 必着

■定員 40名
 (定員になり次第締め切らせて頂きます)

■申込方法 参加のお申し込みは、
 下記URLから申込書をダウンロードして下さい。
<http://semiconjeitassc.jeita-sdte.com/srg/>

■参加費 20,000円 (JEITA会員) 25,000円 (非会員) 3,000円 (学生) 税込
特別参加 ¥33,000 (聴講は2名まで可能 EDR-4705A,EDR-4707A 1セットをお付けします。)

※会員・非会員の区分は、申込各位にてご確認ください。(特別参加の場合、区分不要)
 (JEITA会員一覧) <http://www.jeita.or.jp/cgi-bin/member/list.cgi>
 ※お申込み後のキャンセルはお断りさせていただいております。
 ※セミナーにて解説する内容をまとめた資料を当日配布いたします。
 ※セミナー参加者向けの当該ガイドライン特別頒布価格を設定させていただいております。
 まだお持ちでない方は冊子の入手をお勧めいたします。ただし、専用申込書(別紙)での
 お申込みに限りませのでご留意願います。



規格・ガイドライン名	番号	セミナー参加 特別頒布価格
JEITAソフトウェア試験ガイドライン	EDR-4705A	¥4,000
LSIの故障メカニズム及び試験方法に関する調査報告	EDR-4707A	¥9,000

■お知らせ (今後の開催予定について)
 2018年度も各地での開催を予定しておりますので、皆様のご参加をお待ちしております。
 開催詳細につきましては、ホームページ等で公開予定です。

■運営事務局・各種問合せ先
 株式会社 ティアテック
 JEITA信頼性セミナー運営事務局 担当: 佐久間
 〒135-0034 東京都江東区永代2-16-1 ティアテックビル
 TEL: 03-5875-9250 FAX: 03-5875-9251 E-mail: jeita@tiatech.com

■主催 一般社団法人 電子情報技術産業協会 半導体信頼性技術委員会
 〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3 大手センタービル

※申し込み時に入力いただきました個人情報は本セミナーの受付、次回ご案内の為に使用いたします。
 他の目的で使用することはありません。
 ※JEITAの個人情報保護方針につきましては下記をご参照ください。
<http://www.jeita.or.jp/japanese/privacy/>